

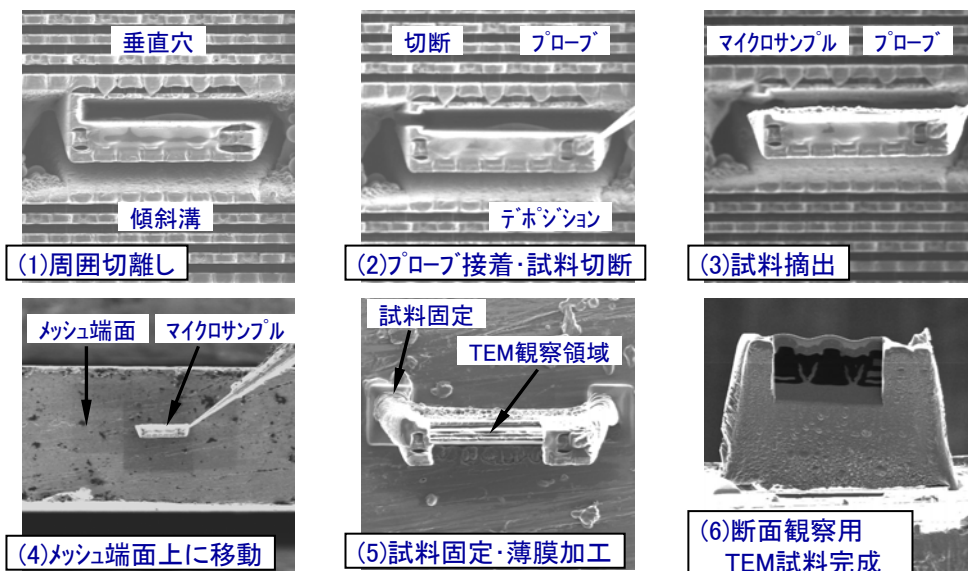
マイクロサンプリング法

FIB: 集束イオンビーム加工

概要

■概要・手順

試料から直接小片を取り出し(マイクロサンプリング)、FIB加工を行うことができます。



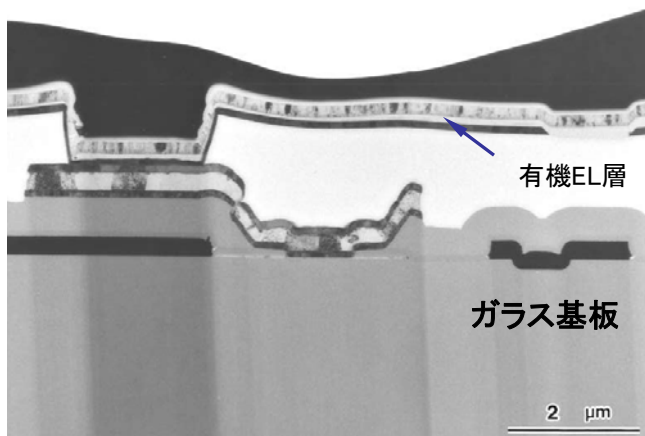
SIM像提供: (株)日立ハイテクノロジーズ

■特徴

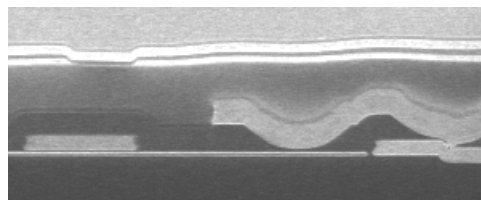
- ・耐水性が無い、剥離し易い等の難ダイシング材料からのサンプリングができます。
- ・近接した複数の断面をTEM試料にできます。
- ・微小チップからのサンプリングに有効です。
- ・EDX分析の際、基板の影響が軽減されます。
- ・同一箇所市直交2断面からのTEM観察も可能です。

データ例: 有機EL素子

■有機EL層部



■TFT部



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <http://www.mst.or.jp/>